

ST03D-82

82V 300W

特長

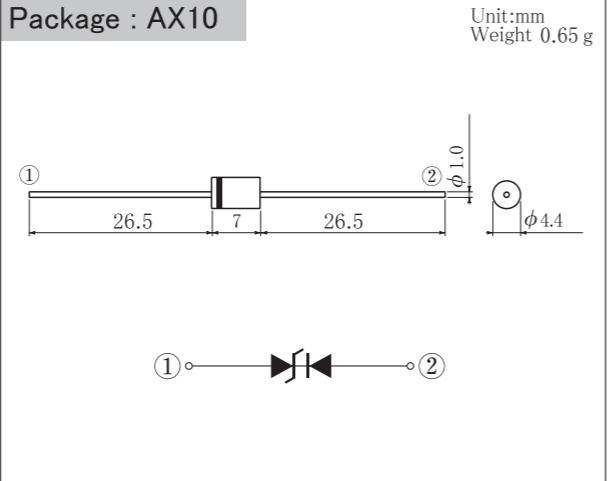
- ・パワーゼネラーダイオードとFRDを複合
- ・アキシャル型
- ・スナバ回路用途

Feature

- ・Power Zener Diodes with FRD
- ・Axial Package
- ・Application for snubber circuit

■外観図 OUTLINE

Package : AX10

Unit:mm
Weight 0.65 g

外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

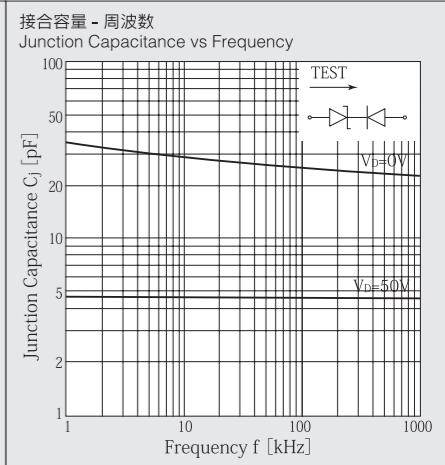
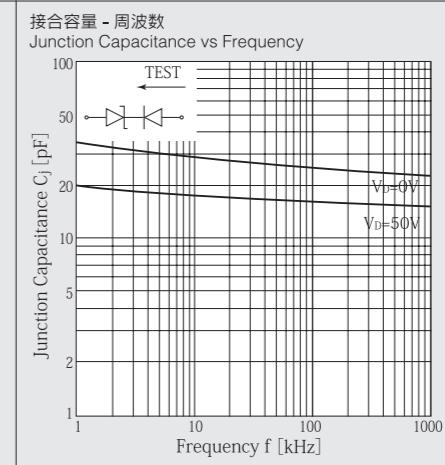
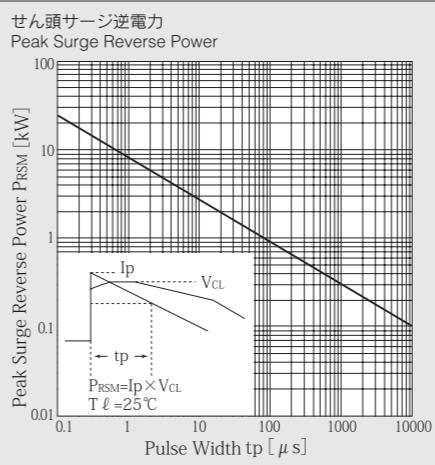
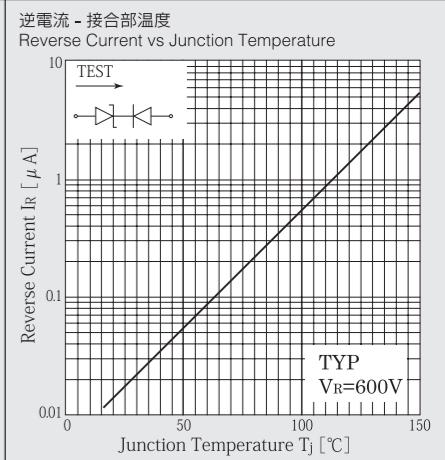
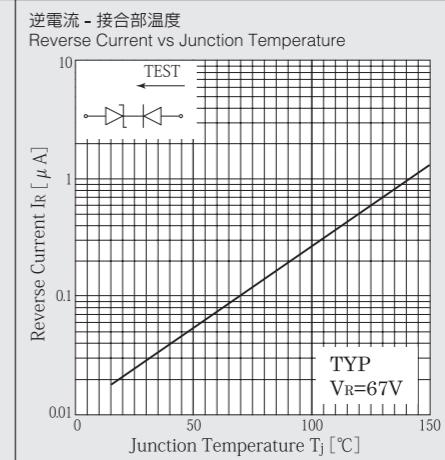
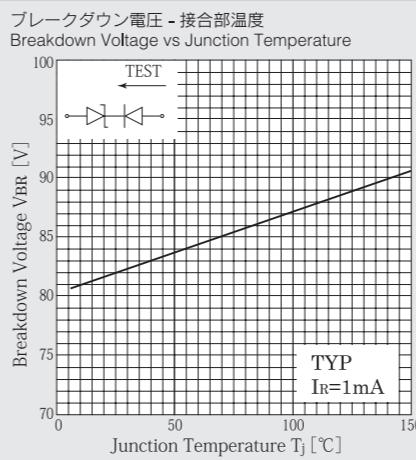
■定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 T₁=25°C / unless otherwise specified)

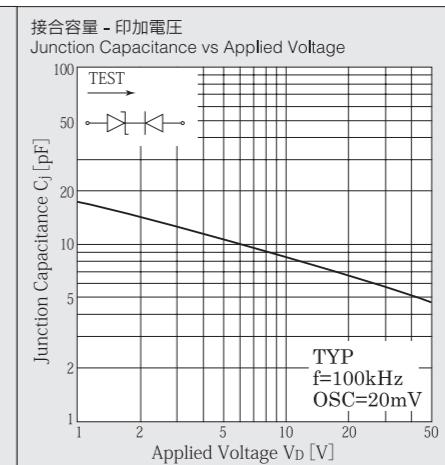
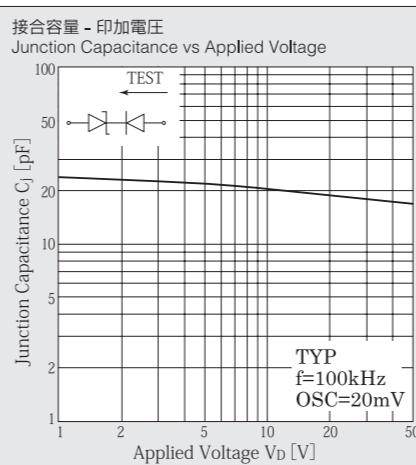
| 項目 Item | 記号 Symbol | 条件 Conditions | ZD | Di | 単位 Unit |
|---|------------------|---|---------|---------|---------|
| 保存温度 Storage temperature | T _{stg} | | -40~150 | -40~150 | °C |
| 接合部温度 Operating junction temperature | T _j | | 150 | 150 | °C |
| せん頭サージ逆電力 Maximum surge reverse power | PRSM | 10/1000μs 非繰り返し 10/1000μs Non-repetitive | 300 | - | W |
| せん頭サージ逆電流 Maximum surge reverse current | IRSM | 10/1000μs 非繰り返し 10/1000μs Non-repetitive | 2.5 | - | A |
| 連続印加電圧 Maximum reverse voltage | VRM | | 67 | 600 | V |

AX10 Package

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 T₁=25°C / unless otherwise specified)

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|----------|----|
| 動作開始電圧 Breakdown voltage | VBR | I _R =1mA | MIN. 74 TYP. 82 MAX. 90 | - | V |
| 制限電圧 Restriction voltage | VCL | I _{pp} =2.5A | MAX. 118 | - | V |
| 逆電流 Reverse current | IR | V _R =67V | MAX. 5 | - | μA |
| | | V _R =600V | - | MAX. 5 | |
| 逆回復時間 Reverse recovery time | trr | I _F / I _R = 0.1A / 0.3A | - | MAX. 500 | ns |
| 熱抵抗 Thermal resistance | θ _{jl} | 接合部・リード間 junction to lead | MAX. 13 | °C/W | |



*Sine waveは50Hzで測定しています。
*50Hz sine wave is used for measurements.
*半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。
Typicalは統計的な実力を表しています。
*Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical a statistical average of the devices ability.